

最 高 行 政 法 院 判 決

114年度上字第40號

上 訴 人 即

原審參加人 黃秀媛

訴訟代理人 黃世瑋 律師

上 訴 人

即原審被告 經濟部智慧財產局

代 表 人 廖承威

被 上 訴 人

即原審原告 費西產品設計研發有限公司

代 表 人 陳冠名

訴訟代理人 林冠佑 律師

張尚宸 律師

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國113年11月13日智慧財產及商業法院113年度行專訴字第2號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

一、上訴駁回。

二、上訴審訴訟費用由上訴人黃秀媛負擔。

理 由

一、上訴人黃秀媛（下逕稱黃秀媛）於民國106年4月13日以「雷射干擾器」申請發明專利，經上訴人經濟部智慧財產局（下逕稱智慧局）審查後，於107年3月26日准予專利，並發給發明第I630405號專利證書（下稱系爭專利，申請專利範圍共10項）。嗣被上訴人110年4月9日以系爭專利違反專利法第22條第1項第1款及第2項規定對之提起舉發，黃秀媛於110年7

01 月9日申請更正系爭專利（更正後申請專利範圍共13項）。
02 經智慧局審查後，以112年4月14日（112）智專三(二)04181字
03 第11220344890號專利舉發審定書為「110年7月9日之更正事
04 項，准予更正」、「請求項1至13舉發不成立」之處分（下
05 稱原處分）。被上訴人對原處分關於舉發不成立部分不服，
06 循序提起行政訴訟，並聲明：訴願決定及原處分關於「請求
07 項1至13舉發不成立，應予撤銷」部分均撤銷、智慧局就系
08 爭專利應為舉發成立撤銷專利權之審定。經原審判決撤銷訴
09 願決定及原處分關於「系爭專利請求項1至13舉發不成立」
10 部分，並命智慧局就系爭專利應為「請求項1至13舉發成
11 立，應予撤銷」之處分，黃秀媛不服，提起本件上訴。

12 二、被上訴人起訴主張、黃秀媛及智慧局於原審答辯，暨原判決
13 理由，均引用原判決之記載。

14 三、本院經核原判決並無違誤，茲就上訴意旨補充論斷如下：

15 (一)專利法第58條第4項規定：「發明專利權範圍，以申請專利
16 範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖
17 式。」由於文字用語之多義性及理解之易誤性，因此解釋申
18 請專利範圍時，得審酌說明書及圖式，並應就專利說明書整
19 體觀察，以瞭解該發明之目的、作用及效果。又申請專利範
20 圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，除
21 說明書已明確表示申請專利範圍應限於實施例及圖式外，不
22 得將說明書及圖式之限制條件讀入申請專利範圍，變更申請
23 專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍。本件依系爭專
24 利說明書第[0003]段記載「習知之雷射干擾器一般是在收到
25 該偵測器之雷射光後，透過連續發射一干擾雷射光來覆蓋反
26 射之雷射光。然而此類習知技術並未針對該偵測器之雷射光
27 的波長、訊號發射頻率、振幅等性質進一步分析比對，效果
28 較差」，第[0011]段記載「該干擾雷射光21之發射訊號頻率
29 與該入射雷射光40之發射訊號頻率相同，確保同步干擾該雷
30 射偵測器接收反射之入射雷射光。該干擾脈波22之振幅較佳
31 大於該入射脈波41之振幅，以有效覆蓋該入射脈波41。各該

01 干擾脈波22持續至重疊於其中一該入射脈波41之1/2以上，
02 較佳為重疊3/4以上、甚至『完全重疊』，以完全阻斷、干
03 擾該雷射偵測器接收反射之入射雷射光……」可知，系爭專
04 利係藉由與入射脈波相同頻率之干擾脈波，間斷地於各入射
05 脈波間隔時間內發出，使各干擾脈波重疊入射脈波（或反射
06 脈波），使干擾脈波早於（或同時於）「反射之入射雷射
07 光」（即反射脈波）為測速槍所接收，藉此干擾測速槍偵測
08 到正確數值。至各干擾脈波與入射脈波彼此重疊程度，系爭
09 專利圖6雖僅顯示部分重疊，惟依上開說明書已明確記載可
10 為1/2以上、3/4以上或完全重疊，依上開說明，申請專利範
11 圍既係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，
12 自不限於系爭專利圖6之實施例，原判決據此而認定：系爭
13 專利請求項1有關「複數干擾脈波……各持續至重疊於其中
14 一該入射脈波」技術特徵，應解釋為「各干擾脈波與各入射
15 脈波在時域上至少部分重疊」，且該入射脈波包含「反射之
16 入射脈波」（即反射脈波），並未排除二者完全重疊之情
17 形，並無違誤。上訴意旨主張依系爭專利請求項1之記載，
18 各該複數之干擾脈波一定會提前於各該擬被干擾之入射脈波
19 發射，且依說明書及圖6所揭示內容，系爭專利請求項1「各
20 持續至重疊於其中一該入射脈波」之技術特徵，應僅限於
21 「部分重疊」，原判決有關係爭專利請求項1「複數干擾脈
22 波……各持續至重疊於其中一該入射脈波」技術特徵之解
23 釋，顯係以系爭專利說明書所載之實施例讀入並變更申請專
24 利範圍云云，指摘原判決有適用專利法第58條不當之違背法
25 令，並非可採。

26 (二)按進步性之判斷涉及複數引證技術內容之結合時，應考量該
27 所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證
28 之技術內容而完成該發明，而是否有動機能結合複數引證，
29 則應綜合考量技術領域之關連性、所欲解決問題之共通性、
30 功能或作用之共通性及教示或建議等事項。本件甲證2圖1及
31 說明書第[0026]至[0031]段、圖3及說明書第[0029]、[003

01 1]、[0048]、[0049]段實施例，已對應揭露系爭專利請求項
02 1之「一光接收器，供接收一包括複數入射脈波之入射雷射
03 光並產生一與該複數入射脈波相關聯之入射光訊號」、「一
04 光發射器」、「一處理單元，依據該入射光訊號計算該複數
05 入射脈波之相鄰二者之間的間隔時間、且驅動該光發射器產
06 生一干擾雷射光，該干擾雷射光包括複數干擾脈波，該複數
07 干擾脈波間斷地各於該複數入射脈波之間隔時間內發射」技
08 術特徵；第[0050]段實施例，則揭露干擾信號與監測脈波
09 「同相/同相位」，即指二信號在時域上完全重疊，已對應
10 圖3所未揭露系爭專利請求項1之「該複數干擾脈波……各持
11 續至重疊於其中一該入射脈波」技術特徵。另甲證4圖1、圖
12 3及說明書第[0039]、[0041]、[0051]段之實施例，已對應
13 揭露系爭專利請求項1之「一種雷射干擾器，包括：一光接
14 收器，供接收一包括複數入射脈波之入射雷射光並產生一與
15 該複數入射脈波相關聯之入射光訊號」、「一光發射器」、
16 「一處理單元，依據該入射光訊號計算該複數入射脈波之相
17 鄰二者之間的間隔時間、且驅動該光發射器產生一干擾雷射
18 光，該干擾雷射光包括複數干擾脈波」、「該複數干擾脈波
19 間斷地各於該複數入射脈波之間隔時間內發射」技術特徵；
20 第[0057]段實施例則揭露將干擾脈波與反射脈波（即反射之
21 入射脈波）相互重疊，使得量測裝置（即測速槍）無法正確
22 量測，對應揭露系爭專利請求項1之「該複數干擾脈波……
23 各持續至重疊於其中一該入射脈波」技術特徵，故系爭專利
24 請求項1之全部技術特徵已見於甲證2或甲證4，為原審依法
25 確定之事實，核與卷內證據相符。原判決據以論明：甲證
26 2、4之不同實施例，各已共同揭露系爭專利請求項1之全部
27 技術特徵，則對所屬技術領域中具有通常知識者而言，將同
28 一先前技術中不同實施例之內容相互組合，實屬顯而易見。
29 況甲證2、4之技術內容均為雷射干擾器，其技術領域相同，
30 二者均以有效干擾測速器為其所欲解決之問題或目的，二者
31 所採取之技術手段，均為偵測測速器之入射脈波後，由處理

01 器驅動光發射器發出干擾脈波，使測速器無法正確判別車輛
02 速度，就光接收器、處理器及光發射器等相同硬體構件，及
03 其產生干擾脈波之功能、作用等具有共通性，故甲證2、4之
04 組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，於法並無不
05 合。上訴意旨主張甲證2係解決因傳輸速度、傳輸的資料量
06 增加所產生之雷射二極體溫度過熱問題，甲證4提供可以更
07 清楚識別量測裝置何時遭到反制之裝置，與系爭專利所欲解
08 決問題各有不同；又甲證2係使用資料庫存取測速器信號的
09 頻率值，且針對測速訊號存取干擾訊號的頻率值，未如甲證
10 4使用記憶體儲存測量設備特徵信號和反射信號的資料庫，
11 亦與系爭專利之功能或作用不具共通性或關連性云云，指摘
12 原判決有不備理由之違背法令，即屬無據。

13 (三)行政訴訟法第243條第2項第6款所謂判決理由矛盾，須判決
14 理由前後牴觸，或判決主文與理由不符，足以影響裁判結果
15 之情形，始足當之。系爭專利請求項1之內容為「一種雷射
16 干擾器，包括：一光接收器，供接收一包括複數入射脈波之
17 入射雷射光並產生一與該複數入射脈波相關聯之入射光訊
18 號；一光發射器；一處理單元，依據該入射光訊號計算該複
19 數入射脈波之相鄰二者之間的間隔時間、且驅動該光發射器
20 產生一干擾雷射光，該干擾雷射光包括複數干擾脈波，該複
21 數干擾脈波間斷地各於該複數入射脈波之間隔時間內發射、
22 且各持續至重疊於其中一該入射脈波。」本件甲證2圖1及說
23 明書第[0026]至[0031]段、圖3及說明書第[0029]、[003
24 1]、[0048]、[0049]段實施例，係對應揭露系爭專利請求項
25 1之「一光接收器，供接收一包括複數入射脈波之入射雷射
26 光並產生一與該複數入射脈波相關聯之入射光訊號」、「一
27 光發射器」、「一處理單元，依據該入射光訊號計算該複數
28 入射脈波之相鄰二者之間的間隔時間、且驅動該光發射器產
29 生一干擾雷射光，該干擾雷射光包括複數干擾脈波，該複數
30 干擾脈波間斷地各於該複數入射脈波之間隔時間內發射」技
31 術特徵，已如前述，則原判決認定甲證2上開技術內容與系

01 爭專利請求項1之差異僅在於「該複數干擾脈波……各持續
02 至重疊於其中一該入射脈波」技術特徵，並無違誤。上訴意
03 旨主張原判決認定甲證2圖3已揭露系爭專利請求項1「一處
04 理單元，依據該入射光訊號計算該複數入射脈波之相鄰二者
05 之間的間隔時間、且驅動該光發射器產生一干擾雷射光，該
06 干擾雷射光包括複數干擾脈波，該複數干擾脈波間斷地各於
07 該複數入射脈波之間隔時間內發射」之技術特徵，另一方面
08 又認甲證2圖3與系爭專利請求項1間具有差異技術特徵存
09 在，顯有判決理由矛盾之違背法令，洵無足取。

10 (四)上訴意旨另主張甲證2說明書第[0050]段之「in phase」係
11 指干擾脈波與測速脈波週期完全相同，是甲證2之干擾脈波
12 顯然未於複數測速脈波之間隔時間內發射，故甲證2未揭露
13 系爭專利入射脈波與干擾脈波係「部分重疊」之技術特徵；
14 甲證4說明書第[0057]段揭露其干擾脈波使得測速裝置將該
15 干擾脈波識別為真實訊號，故該干擾脈波與測速脈波週期應
16 完全相同，干擾脈波並未在複數測速脈波之間隔時間內發射
17 而呈現「部分重疊」，且依甲證4圖3可知，入射脈波與干擾
18 脈波間至少存在時間差 Δt_2 加T而相互不重疊，是甲證4亦未
19 揭露系爭專利請求項1「該複數干擾脈波間斷地各於該複數
20 入射脈波之間隔時間內發射、且各持續至重疊於其中一該入
21 射脈波」技術特徵等語。惟系爭專利請求項1有關「複數干
22 擾脈波……各持續至重疊於其中一該入射脈波」技術特徵，
23 應解釋為「各干擾脈波與各入射脈波在時域上至少部分重
24 疊」，且該入射脈波包含「反射之入射脈波」（即反射脈
25 波），並未排除二者完全重疊之情形，已如前述。原判決復
26 已論明：依甲證2說明書第[0031]段記載「該微處理器將該
27 電監測信號處理為具有所選第二頻率之電干擾信號10，並將
28 此信號傳送至干擾信號轉換器5，該干擾信號轉換器將該電
29 干擾信號轉換為干擾雷射信號11後，便由光學發射器6發射
30 該干擾雷射信號至該雷射測速器」，另依甲證2圖3之監測信
31 號與干擾信號之時域圖，以及說明書第[0049]段記載「由二

01 條虛線所標示之時窗具有等於 Δt_1 之時段。該干擾信號中之
02 脈波列必須在此時窗所標示之時段內發射，以確保該雷射測
03 速器能依其自身之預期，在所述時段內偵測到並顯示所述脈
04 波列，並因而將所接收之脈波列解讀為其所發射之監測脈波
05 列之反射」可知，甲證2之干擾信號之脈波列係在複數監測
06 信號之間隔時間內發射，而已揭露系爭專利請求項1之「一
07 處理單元，依據該入射光訊號計算該複數入射脈波之相鄰二
08 者之間的間隔時間、且驅動該光發射器產生一干擾雷射光，
09 該干擾雷射光包括複數干擾脈波，該複數干擾脈波間斷地各
10 於該複數入射脈波之間隔時間內發射」技術特徵。另依甲證
11 4說明書第[0039]段記載「反制轉發器110包含中央處理單元
12 (CPU)或數位信號處理器(DSP)155，且該CPU或DSP係連接至
13 多個周邊元件……」、第[0041]段記載「……該反制轉發器
14 可根據一量測裝置之信號特徵辨識該量測裝置，並在預期之
15 時窗內發射干擾信號……」可知，甲證4之反制轉發器係以
16 中央處理單元(155)來計算入射脈波之間隔時間，並驅動光
17 學發射器(145/150)產生干擾信號。又甲證4說明書第[0057]
18 段記載「根據本發明之實施例，該反制轉發器可辨識並干擾
19 經程式化後可辨識及忽略形狀與回射信號之預期形狀不同之
20 干擾信號之量測裝置……例如，該反制裝置發送所謂誘餌信
21 號，例如一矩形信號，其目的係令反射信號與遮蔽信號重疊
22 (overlap)，並因而呈現矩形。該量測裝置會將該反射信號
23 視為假信號而加以忽略……」內容，可知甲證4揭露將干擾
24 信號之脈波與反射脈波（即反射之入射脈波）重疊，使得量
25 測裝置（即測速槍）無法正確量測，已揭露系爭專利請求項
26 1之「一處理單元，依據該入射光訊號計算該複數入射脈波
27 之相鄰二者之間的間隔時間、且驅動該光發射器產生一干擾
28 雷射光，該干擾雷射光包括複數干擾脈波，該複數干擾脈波
29 間斷地各於該複數入射脈波之間隔時間內發射、且各持續至
30 重疊於其中一該入射脈波」技術特徵等情。此外，甲證4圖3
31 係用以解說中央處理單元所執行各種計算，其中，T為量測

裝置發射脈波1與2之經過時間，故反制轉發器110以中央處理器計算複數入射脈波之相鄰間隔時間為T，再依甲證4說明書第[0040]段記載「……若量測裝置在預期之時窗內偵測到回射信號，或可利用程式將所接收之最強或最弱信號判別為其所預期之反射信號。」並參酌前述第[0041]段內容可知，甲證4之發明既係利用在預期之時窗內發射干擾信號方式，以改變量測裝置所感知之反射脈波，則複數干擾信號之脈波自係於複數入射脈波之間隔時間內發射，始可達成干擾信號之脈波與反射脈波重疊，並使量測裝置無法正確量測之目的，尚難依甲證4圖3即謂入射脈波與干擾信號之脈波間至少存在時間差 Δt_2 加T而相互不重疊。上訴意旨猶執前詞，主張原判決有認定事實未依證據及判決不備理由之違背法令，亦非可採。

(五)綜上，原判決並無上訴人所指違背法令之情形，上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

四、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第2條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段、第104條、民事訴訟法第85條第1項但書，判決如主文。

中 華 民 國 114 年 10 月 15 日

最高行政法院第一庭

審判長法官 胡 方 新

法官 鍾 啟 煒

法官 張 國 勳

法官 林 麗 真

法官 林 欣 蓉

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

中 華 民 國 114 年 10 月 15 日

書記官 張 玉 純